

초순수 시약 저장 및 미량 분석 응용 분야를 위한 반도체 등급 고순도 Pfa 샘플링 병

품목 번호: PL-CP194



소개

반도체 등급 시약 저장 및 미량 분석을 위해 설계된 고순도 PFA 샘플링 병입니다. 이 불활성 용기는 금속 이온 용출 및 오염을 방지하여 중요한 산업용 실험실 프로세스 및 초순수 유체 처리를 위한 기준선 안정성과 데이터 재현성을 보장합니다. 지금 문의하세요.

[자세히 알아보기](#)

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 제조	웨이퍼 처리에 사용되는 초고순도(UHP) 화학 물질 및 포토레지스트의 저장 및 운송.	웨이퍼 결함을 유발할 수 있는 미량 금속 오염을 방지합니다.
미량 원소 분석	환경 또는 지질 연구에서 ICP-MS, ICP-OES 및 AAS용 샘플 및 표준 물질 수송.	초저 배경 수준과 높은 데이터 재현성을 보장합니다.
촉매 잉크 저장	전기화학적 테스트를 위한 이소프로판올, 나피온 및 다양한 촉매를 포함하는 슬러리 보관.	매끄러운 벽이면 잔여물 손실을 방지하고 슬러리 일관성을 유지합니다.
LC-MS/MS 샘플 준비	액체 크로마토그래피를 위한 초순수 및 암모늄 아세테이트와 같은 고순도 용매 저장.	용매 침투 및 가스제나 금속 이온의 용출을 방지합니다.
실리콘 농도 검출	식품 조직 또는 산업용 재료의 미량 실리콘 분석을 위한 샘플 이동 및 저장.	벽에서의 실리콘 용출 및 샘플 구성 요소의 흡착을 방지합니다.
산 분해 워크플로우	희석 및 측정을 기다리는 고부식성 분해 샘플(예: HF, HNO3) 저장.	고온에서 광물산에 대한 뛰어난 저항성을 제공합니다.
표준 참조 물질	인증 참조 물질 및 1차 교정 표준의 장기 보관기록 보관.	증발 및 흡착을 방지하여 농도 안정성을 유지합니다.
배터리 연구	제어된 실험실 환경에서 전해질 구성 요소 및 특수 첨가제 처리.	화학적 불활성이 전기화학적 결과에 간섭하지 않음을 보장합니다.
특징	PL-CP194 시리즈 사양	
소재	고순도 퍼플루오로알콕시(PFA)	
제품 식별	PL-CP194	
온도 저항 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)	
화학적 저항성	보편적 (용용 알칼리 금속, 불소 가스 제외)	
미량 금속 배경	주요 원소에 대해 < 10 ppt (조당 부수)	
표면 장력/습윤성	소수성, 극도로 낮은 표면 에너지	
표준 용량 (예시)	500ml, 1000ml (완전 사용자 정의 가능)	
캡 디자인	기밀 밀봉을 위한 라이너 없는 고토크 스크류 캡	
제조 방법	정밀 성형 및/또는 맞춤형 CNC 가공	
세척 프로토콜	반도체 등급 초순수 물/산 세척 옵션 제공	
치수	클라이언트 사양에 맞춰 제조	